

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number : 11-108810

(43) Date of publication of application : 23.04.1999

(51) Int.CI.

G01N 1/28

(21) Application number : 09-268363

(71) Applicant : HITACHI LTD

(22) Date of filing : 01.10.1997

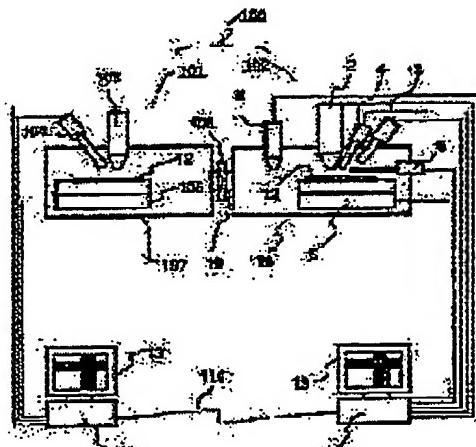
(72) Inventor : UMEMURA KAORU

(54) METHOD AND DEVICE FOR ANALYZING SAMPLE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To carry out positioning without cutting and separating the wafer and to permit the analysis of a desired area by extracting a sample piece including the desired part from a sample substrate on the basis of the coordinates information on the desired part, processing the sample piece fixed to a sample holder into a form suitable for analysis, introducing the sample holder to an analyzing device, and performing analysis.

SOLUTION: In a sample analyzing device 100, a wafer inspecting part 101 and a sample preparing part 102 are mechanically connected with each other. The wafer inspecting part 101 is composed of an electron beam irradiating optical system 103, a secondary electron detector 104, a sample stage 105, etc., and coordinates information on a detected desired part is stored in a computation processing device 17' and transmitted to the computation processing part 17 of the sample preparing part 102 by an information transmitting means 110. The sample preparing part 102 is provided with a focusing ion beam(FIB) irradiating optical system 2 for the processing and observation of a sample substrate 12 and extracted samples, a secondary particle detector 3, a transferring means 8 to transfer an extracted sample to a sample holder 6, a display means 13 to display images by an optical microscope 9 and the secondary particle detector 3, a sample chamber 18, etc.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

08.10.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

2005/NOV/10/THU 05:08 PM MICHAEL O SCHEINBERG

Searching PAJ

FAX No. 512 306 1963

P. 022

<http://www19.ipdincipi.go.jp/PAI/result/detail/main/wAAAJsG>

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3677968

[Date of registration]

20.05.2005

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

11/8/2005 4:43

PAGE 22/60 * RCVD AT 11/10/2005 5:59:44 PM [Eastern Standard Time] * SVR:USPTO-EFXRF-6/24 * DNIS:2738300 * CSID:512 306 1963 * DURATION (mm:ss):20-10

JP 3677968 B2 2005.8.3

(18) 日本国特許庁(JP)

(12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第3677968号
(P2005.8.3)

(45) 発行日 平成17年8月9日(2005.8.3)

(24) 登録日 平成17年5月20日(2005.5.20)

(51) Int. Cl.
G01N 1/28

F1

G01N 1/28
G01N 1/28
G01N 1/28

G

H

F

請求項の数 7 (全 17 頁)

(21) 出願番号 特願平9-268363
 (22) 出願日 平成9年10月1日(1997.10.1)
 (65) 公開番号 特開平11-108810
 (43) 公開日 平成11年4月23日(1999.4.23)
 (54) 審査請求日 平成14年10月8日(2002.10.8)

(73) 特許権者 000005108
 株式会社日立製作所
 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
 (74) 代理人 100075096
 弁理士 作田 康夫
 (72) 発明者 梅村 葦
 東京都四谷市京橋ケ塙一丁目280番地
 株式会社日立製作所中央研究所内
 審査官 本郷 徹

最終頁に続く

(54) [発明の名稱] 試料解析方法および装置

(57) [特許請求の範囲]

【請求項 1】

真空試料室内に配置された試料基板から所望の試料片を摘出する試料作製方法において、
 前記所望の試料片を前記試料基板から該真空試料室内で分離する工程と、
 該真空試料室内でプローブを当該試料片に固定する工程と、
 該試料片を前記真空試料室内に設けられた試料ホルダに固定する工程と、
 前記試料ホルダに固定された試料片から、前記プローブを前記真空試料室内で分離する
 工程とを含むことを特徴とする試料作製方法。

【請求項 2】

請求項1に記載の試料作製方法において、
 前記プローブから分離された試料片に対して、前記試料室内で仕上げ加工を施す工程を
 更に含むことを特徴とする試料作製方法。

【請求項 3】

請求項2に記載の試料作製方法において、
 前記仕上げ加工として、前記試料片のウォール加工、ないし集束イオンビーム照射によ
 る加工を行なうことを特徴とする試料作製方法。

【請求項 4】

請求項3に記載の試料作製方法において、
 前記プローブの分離された試料片が固定された試料ホルダを、試料作製が行なわれる試 20

(2)

JP 3677968 B2 2005. 8. 3

料作製装置とは別の解析手段に導入する工程を含むことを特徴とする試料作製方法。

【請求項 5】

請求項 4 に記載の試料作製方法において、

前記別の解析手段が、TEM、SEM、オージェ電子分光装置または二次イオン質量分析装置のいずれかであることを特徴とする試料作製方法。

【請求項 6】

請求項 5 に記載の試料作製方法において、

前記プローブを当該試料片に固定する工程は、

前記試料基板から分離される前の試料片に対してプローブ先端部を接触させる工程と、

該プローブ先端部を含む領域にデポジション用ガスを流す工程と、

当該プローブ先端部を含む領域に集束イオンビームを走査する工程とを備えることにより、前記プローブと前記分離前の試料片とを固定することを特徴とする試料作製方法。

10

【請求項 7】

請求項 1 に記載の試料作製方法において、

前記試料片を試料ホルダに固定する工程は、

前記プローブが固定された試料片を前記試料ホルダに接触させる工程と、

該試料片と試料ホルダの接触部にデポジションガスを流す工程と、

該接触部に集束イオンビームを照射する工程とを含むことを特徴とする試料作製方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、半導体ウエハを検査して微小異物や欠陥など所望箇所を検出し、その所望箇所を含む試料片を集束イオンビームと移送手段を用いて抽出して、上記試料片を観察や分析、計測装置に対応した形状に加工して観察や分析、計測装置に送る試料解析方法および試料解析装置に係わる。

20

【0002】

【従来の技術】

半導体素子製造では良品をよどみなく生産し続けることが求められる。生産個数が大量であるため、ある工程での不良発生が製品歩留りの低下や生産ラインの停止につながり、探算に大きく影響する。このため半導体素子の製造現場では、特定のプロセス後やデバイス完成後には入念な検査が行なわれ不良品の発見と原因追及に注力している。実際には製造工程で、定期的または定量数ごとにウエハやデバイスを抜き取り、不良箇所の有無を検査している。ウエハの場合、検査箇所と検査項目を予め決めておき各ウエハに対して常にその検査箇所をモニタして製造プロセスの異常を検出する方法や、完成後のウエハ全面を限りなく検査して、回路パターンの欠陥や異物など異常箇所があればそのデバイスを廃棄したり、異常原因を追及して対策する方法が行なわれる。

30

【0003】

検査方法の一例として、ウエハ全面もしくは一部の領域の外観について異物の付着や形成された回路パターンの欠陥などを検出する検査方法があり、光や電子線を用いたウエハ外観検査装置（以下、ウエハ検査装置と略記）やウエハ検査電子顕微鏡（以下、検査SEMと略記）や、回路の断線や短絡など電気的不良を検出するプローバ装置などがある。

40

【0004】

さらに詳細な試料外観観察には高分解能の走査型電子顕微鏡（以下、SEMと略記）が用いられるが、半導体の高集積化に伴い、対象物がSEMの分解能では観察できないほど極微細なものについても解析することが必要となっている。この場合、SEMに代って観察分解能が高い透過型電子顕微鏡（以下、TEMと略記）が有力な装置となっている。

【0005】

ここでTEM用の試料作製方法について説明する。図2は従来のTEM試料の作製方法のうちの一つを説明する図である。図2(a)はLSIを形成した半導体ウエハ（以下、略してウエハ30という）で、上層部31と基板部32とからなる。このウエハ30のうちの特定領域

50

(3)

JP 3677968 B2 2005.8.3

についてTEM試料を作製するとする。まず、観察したい領域に目印を付け、観察領域を破壊しないようにウエハ30にダイアモンドペンなどで傷付け劈開するか、ダイシングソーデで例えれば切断線33に沿って分断する。図2(b)のような切り出した短冊状ペレット34で例えばTEM試料の中央部が観察領域となるようにするため、観察領域同士を向かい合うように接着剤35で貼り合わせて、貼り合わせ試料36を作る(図2(c))。次に、この貼り合わせ試料36をダイヤモンドカッターでスライスし、スライス試料37を切り出す(図2(d))。このスライス試料37の大きさは、 $3 \times 3 \times 0.5\text{mm}$ 程度である。さらに、このスライス試料37を研磨材を用いて研磨盤上で薄く研磨し、厚さ $20\mu\text{m}$ 程度の研磨試料38を作製し、これをTEMステージに搭載する単孔型TEMホルダ39に固定する(図2(e))。次に、この研磨試料38の両面からにイオンビーム40照射(図2(f))して、イオンシニングを行い(図2(g))、中央部に穴が開いたイオンビーム40照射を止めてTEM試料41とする(図2(h))。こうして、 100nm 程度以下に薄くなった薄片部42をTEM観察領域(図中円内)としていた。このような方法であるため、観察したい箇所がミクロンレベルで特定されている場合、位置出しは非常に難しい。

【0006】

また、TEM試料作製に関する別の従来手法として東京イオンビーム(以下、FIBと略す)加工を利用する例がある。図3で説明する。まず、観察すべき領域の近傍を、図3(a)に示すようにウエハ80をダイシングを行って(符号33が切断線である。)短冊状ペレット34を切り出す(図3(b))。このペレットの大きさは、およそ $3 \times 0.05 \times 0.5\text{mm}$ (ウエハの厚み)である。この短冊状ペレット34をやや半円形した薄い金属片からなるTEM試料ホルダ37に固定する(図3(c))。この短冊状ペレット34の中の観察領域を、厚さ0.1ミクロン程度の薄片部(以下、ウォール部という)43を残すようにFIB24を照射し(図3(d))、薄壁部を形成する(以下、ウォール加工と言う。図3(e))。これをTEM試料41として、TEMホルダをTEMステージに搭載し、TEM装置に導入してウォール部43を観察する。この方法によって、観察部をミクロンレベルで位置出しすることが可能になった。また、この手法に関しては、例えば、E.C.G. Kirkらが、論文集 *Microscopy of Semiconducting Materials 1989, Institute of Physics Series No.100.*, p.501-506(公知例1)において説明している。

【0007】

このように、TEMは高分解能観察が期待できるが、試料作製に多大の努力を要するという面を持ち合わせている。

【0008】

【発明が解決しようとする課題】

上述のように、従来の試料解析方法や試料作製方法には以下のような問題点があった。

【0009】

(1) 座標の問題: ウエハ全面もしくは一部の検査によって発見した異物や欠陥などの不良箇所を解析する際、ウエハ検査装置や検査SEMなどの検査装置内で不良箇所の座標が明らかになってしまって、実際に分析装置や観察装置、計測装置(以下、略して分析装置と代表される)に入るような寸法に分断して分析試料片に加工しなければならず、先の不良箇所の正確な位置がわからなくなり、所望の解析ができないという問題が生じる。

【0010】

(2) 試料作製の問題: ウエハ検査装置や検査SEMによるウエハ全面もしくは一部の検査の結果、ある位置に不良箇所を検出しても、ウエハから解析試料片を作製する時に、解析の目的とする微小異物が無くなったり変質したり、又は、別の損傷を引き起こし重複して本来の目的とする不良箇所の原因究明ができなくなることがある。これは従来の試料作製の方法が試料の切断や研磨、へき開など機械的や化学的な手法に依っていたため、当初の不良箇所をそのまま状態で分析装置に導入して的確な解析結果を得る歩留りは高いものではなかった。また、このような的確な解析が長時間に及ぶために最終的な製品に不良品が統発して多大の損害をもたらす場合もある。

【0011】

10

20

30

40

50

50

(4)

JP 3677968 B2 2005. 8. 3

(3) ウエハ破損の問題：製造途中のある工程での仕上がりを監視するために、ウエハへの特定部のみの継続的な検査においては、定期的に定量毎に、たった数点の検査箇所に対してウエハを分断して、検査箇所以外はすべて廃棄している。最近ではウエハ径が20mmとなり、さらに300mm、またそれ以上に大口径化する傾向にあるため、付加価値が高いデバイスが数多く搭載されたウエハを数箇所の検査のために切断や劈開で分離して、廃棄処分することは非常に不経済であった。

100121

ここで、上記問題点(1)から(5)のいずれにも関係する例としてTEM試料を例に説明する。TEMは上述のように高分解能を有しているため、微小部分の解析には有力なツールであるが、不良領域の特定から解析結果が出るまでに非常に長い時間を要するため、観察したいときに即座に結果の見えるSEMのようには普及していない。解析結果までに長時間を要する原因の一つは、TEM観察以前の試料作製過程にある。TEM観察領域は厚さを100nm程度にまで薄片化しなければならないため、従来方法では研磨や機械加工など試料作製と試料作成を極めて困難になる。また、事前に顯微鏡に依ってミクロンオーダで特定して不良領域の位置を試料作製中に見失ったり、間違ってしまうことが多い。また、ウエハから所望の試料片を作製するには、ウエハ劈開や切断など機械的加工によっているため試料への新たな損傷が発生し、本来の不良領域との区別がつかなくなる場合がある。さらに、TEMの試料室は非常に小さく、試料片をミリオーダの大きさに細分化しなければならず、ウエハは必ず分断せざるを得ない。一旦、分析や観察を行った後に、さらに隣接した箇所を別の分析や観察の必要が出た場合には、先の試料作製の分断のために後の分析や観察情報が得られないという問題を発生する。

10

【0018】このような従来技術に対して、各種検査方法によって得られた不良箇所に対して、ウエハ形状を維持したまま、ウエハ上の所望の箇所のみを機械的や化学的な損傷を発生することなく、各種分岐装置に導入できる試料片に加工して解析できる試料解析方法ならびに試料解析装置が説明されていた。

20

100141

上述の諸課題に鑑み、本発明の第1の目的は、ウエハ全面または一部の検査で検出した異物や欠陥など所望箇所を、ウエハを切断分離せずに正確に位置出して、各種分析に適した試料片に加工して各種分析装置上で上記所望領域を解析できる試料解析方法を提供することにある。また、第2の目的は、上記第1目的を実現する試料解析装置を提供することにある。

30

[0015]

【課題を解決するための手段】

上記第1の目的を達成するためには、
目的とする試料片を観察、分析、計測のうちの少なくともいずれかによって調べる試料解析方法であって、試料基板を検査手段によって検出した異物や欠陥など所望箇所の座標情報を記憶する工程と、上記所望箇所の座標情報を基にして上記試料基板から上記所望箇所を含む試料片を集めイオンビームによる加工を利用して摘出して、上記摘出した上記試料片を分析装置または観察装置または計測装置のうちの少なくともいずれかに対応する試料ホルダに固定し、上記試料ホルダに固定した上記試料片を分析または観察または計測のうちの少なくともいずれかに適する形状に加工する工程と、上記試料片を固定した上記試料ホルダを分析装置または観察装置または計測装置のうちの少なくともいずれかに導入して上記所望箇所の解析を行なう工程とからなる試料解析方法を用いて、
特に、上記検査手段が光学式ウエハ検査装置、ウエハ検査用走査電子顕微鏡、レーザ走査顕微鏡、光学式顕微鏡のうちの少なくともいずれかを用いる。

40

100161

また、上記試料片を篠原イオンビームによる加工を利用して摘出する工程の前に、光学顕

50

(5)

JP 3677968 B2 2005.8.3

微鏡による位置合わせ工程をともなってもよい。

[0017]

さらに、上記試料解析方法において、特に、上記試料片を東京イオンビームによる加工を利用して摘出する工程の前に、上記東京イオンビームによって上記所望箇所近傍に上記所望箇所が確認できる目印を付す工程をともなうことで所望箇所を確実に加工できる。

[0018]

また、上記試料解析方法において、上記試料ホルダに固定した上記試料片に対してさらに東京イオンビーム照射による薄壁加工を施して透過型電子顕微鏡観察用の試料に仕上げる工程を含むことで、透過型電子顕微鏡観察までに要する時間が大幅に短縮できる。

[0019]

また、上記第2の目的は、

ウエハを検査して異物や欠陥など所望箇所の座標情報を記憶するウエハ検査部と、上記所望箇所の座標情報を基にして上記試料基板に対して東京イオンビームを利用して上記所望箇所を含む試料片を摘出して分析装置または観察装置または計測装置のうちの少なくともいずれかに適する試料ホルダに固定して、分析装置または観察装置または計測装置のうちの少なくともいずれかに適する形状の試料片に加工する試料作製部と、上記試料片の解析を行なう分析装置または観察装置または計測装置のうちの少なくともいずれかの解析部と行なう分析装置または観察装置または計測装置のうちの少なくともいずれかの解析部とを少なくとも有し、上記ウエハ検査部と試料作製部、解析部とは上記ウエハを移動するための真空搬送路によって連結した構造とする。または、

ウエハを検査して異物や欠陥など所望箇所の座標情報を記憶するウエハ検査部と、上記所望箇所の座標情報を基にして上記試料基板に対して東京イオンビームを利用して上記所望箇所を含む試料片を摘出して分析装置または観察装置または計測装置のうちの少なくともいずれかに適する試料ホルダに固定して、分析装置または観察装置または計測装置のうちの少なくともいずれかに適する形状の試料片に加工する試料作製部と、上記試料片の解析を行なう分析装置または観察装置または計測装置のうちの少なくともいずれかの解析部とを少なくとも有し、上記ウエハ検査部と試料作製部、解析部とは上記ウエハを移動するための真空搬送路によって連結した構造とする。または、

ウエハを検査して異物や欠陥など所望箇所の座標情報を記憶するウエハ検査部と、上記所望箇所の座標情報を基にして上記試料基板に対して東京イオンビームを利用して上記所望箇所を含む試料片を摘出して分析装置または観察装置または計測装置のうちの少なくともいずれかに適する試料ホルダに固定して、分析装置または観察装置または計測装置のうちの少なくともいずれかに適する形状の試料片に加工する試料作製部と、上記試料片の解析を行なう分析装置または観察装置または計測装置のうちの少なくともいずれかの解析部とが機械的に独立して構成され、少なくとも上記ウエハ検査部での上記所望箇所の座標情報を上記試料作製部と上記解析部に伝達する情報伝達手段によって連結した構造とする試料解析装置でもよい。また、この構造においては、さらに、ウエハ検査部と試料作製部と解析部の間は、ウエハおよび試料ホルダもしくは試料ホルダを搭載した治具を真空容器によって搬送する構造としてもよい。

[0020]

上記試料解析装置もしくは試料解析システムにおいて、特に、検査装置が光学式ウエハ検査装置、ウエハ検査用走査電子顕微鏡、レーザ走査顕微鏡、光学式顕微鏡のうちのいずれかにすること、もしくは、解析部における観察装置が特に、インレンズ型走査型電子顕微鏡、透過型電子顕微鏡のうちのいずれかとすることで、効率よく検査することができる。

[0021]

このような試料作製装置を用いることで上記目的は達成される。

[0022]

【発明の実施の形態】

本発明による試料作製装置の実施形態は、ウエハを検査して異物や欠陥など所望箇所の座標情報を記憶するウエハ検査部と、上記所望箇所の座標情報を基にして試料基板に対して東京イオンビームを利用して上記所望箇所を含む試料片を摘出して、分析装置または観察装置または計測装置のうちの少なくともいずれかに適する試料ホルダに固定して、これら装置に対応する形状に加工する試料作製部とから構成され、上記ウエハ検査部と試料作製部

10

20

30

40

50

(6)

JP 3677968 B2 2005.8.3

部とは上記ウエハを移動するための真空搬送路によって連結した構成とする。

[0023]

以下に、その具体的実施形態例を示す。

[0024]

<実施形態例1>

図1は、本発明による試料解析方法を実現するための試料解析装置の一実施例を示す概略構成図である。

[0025]

試料解析装置100は、ウエハ検査部101と試料作製部102が機械的に連結されている。ウエハ検査部101はウエハ外観検査装置や検査SEM、プローバ装置に該当する。ウエハ検査によって不良箇所を検出して解析の必要がある場合、ウエハ検査部101と試料作製部102の間に設置したバルブ106を開いて、ウエハ12を試料作製部102へ搬送できる。試料作製部102で加工作製された試料片は別にあるTEM、SEMなど観察装置や分析装置や計測装置などに搬入して不良箇所を解析する。逆に、ウエハ検査の結果、異常がない場合にはウエハ12は試料作製部102に送る必要はなく、次の製造工程の並行に搬送する。

10

[0026]

ウエハ検査部101の例として、ここでは検査SEMの場合を示しており、電子ビーム照射光学系103、二次電子検出器104、試料室107内でウエハ12を載せて移動可能な試料ステージ105などから構成している。二次電子検出器104に流入する二次電子信号と電子ビーム照射光学系103のビーム偏向を同期させてウエハ表面形状を表示手段13'に表示でき、ウエハ検査部101全体の制御を計算処理装置17'によって行なう。ウエハ検査にはウエハ上に形成された複数個のデバイスを比較する方法や、デバイスの中のセル同士を比較する方法などがあるが、ここでは限定しない。このようなウエハ検査部100で検出された所望箇所の座標情報を一旦、計算処理装置17'に記憶し、情報伝送手段110によって試料作製部102の計算処理部17に伝達できる。また検査中のウエハ外観や座標情報は表示手段13'に表示できる。

20

[0027]

試料作製部102は、試料基板12や摘出試料の加工や観察をするFIB照射光学系2、このFIB照射によって試料から放出する二次電子や二次イオンを検出する二次粒子検出器3、FIB照射領域にデポジション膜を形成するための元材料ガスを供給するデボガス源4、半導体ウエハや半導体チップなどの試料基板12を載置する試料ステージ5、摘出試料を試料ホルダに移し変える移送手段8、試料基板12を観察するための光学顕微鏡9、この光学顕微鏡26による像や二次粒子検出器3による像を映す表示手段13、試料作製部102全体を制御する計算処理装置17、試料ステージ5を設置する試料室18などを少なくとも備えた構成である。さらに詳細を図4を用いて説明する。

30

[0028]

図4は、図1で示した構成部品に加えて、試料基板12の一部を摘出した微小な摘出試料を固定する試料ホルダ6、試料ホルダを保持する保持手段7（以下、ホルダカセットともいう）、試料ステージ5の位置を制御するためのステージ制御装置10、移送手段8を試料ステージ5と独立に駆動するための移送手段制御装置11、試料ホルダ6や試料基板12や移送手段8などをイオンビーム照射によって発生する2次電子または2次イオンによって映像化する画像表示手段13、FIB照射光学系2のFIB制御装置14なども構成され、この他、デボガス源制御装置15、二次粒子検出制御装置16、画像表示手段13、移送手段制御装置11などは計算処理装置17により制御される。

40

[0029]

FIB照射光学系2は、被体金属イオン源20から放出したイオンをビーム制限アバティ21、集束レンズ22、対物レンズ23を通して10nm程度から1ミクロン程度のFIB24を形成する。FIB24を偏向器25を用いて試料基板12上を走査することで、走査形状に試料基板12にミクロンからサブミクロンレベルの加工ができる。ここでの加工と

50

(7)

JP 3677968 B2 2005.8.3

は、スパッタリングによる凹部や、FIBアシストデポジションによる凸部、もしくは、これらを組み合わせて試料基板の形状を換える操作を指す。FIB照射によって形成するデポジション膜は、移送手段8の先端にある接触部と試料基板1-2を接続したり、摘出試料を試料ホルダに固定するために使用する。また、FIB照射時に発生する二次電子や二次イオンを二次粒子検出器3で検出して画像化することで加工領域などを観察することができる。

[0030]

試料ステージ5は試料室18に設置され、FIB照射光学系2なども真空容器内に配置されている。試料ステージ5は、試料ホルダ6を搭載した保持手段(試料ホルダカセット)7が着脱でき、ステージ制御装置10によって、3次元(X,Y,Z)方向の移動及び傾斜、回転が制御される。試料基板12は必要に応じて試料基板搬送路19を用いて出入りする。

10

[0031]

試料ホルダ6は図5に示すような凸型断面をした短冊状シリコン片27である。この短冊状シリコン片27は、シリコンウエハからへき開やダイシングソーを利用して形成した。本実施例で用いた試料ホルダの大きさは長さ2.5mm、上部幅50ミクロン、下部幅200ミクロン、高さ0.5mm(シリコンウエハ厚)で、摘出試料の固定面をシリコンウエハ面または劈開面として、摘出試料70を固定面に固定してTEM観察しても固定面の凹凸が電子線照射を阻害することはない。また、試料ホルダ形状はここに示した寸法に限ることはないが、固定面をウエハ面もしくはへき開面にすることと幅をできる限り薄くすることが、TEM観察しやすくなるために必要である。図5は摘出試料70を一個の試料ホルダ6に3個搭載した例である。一方、従来のTEM用の試料ホルダは図6(a)の単孔型や(b)のメッシュ型であり、単孔型は中央に直径1mm程度の単孔75が設けられた直径3mm程度の薄厚金属円板76であるが、本発明による試料作製方法で得られる摘出試料70のように10~20ミクロンと小さいと、摘出試料70を単孔75の側壁に正確に取付けることが非常に難しい。また、メッシュ型では薄肉金属円板76にはメッシュ77が貼られていて試料の大きさに合わせた間隔のメッシュ77を用いれば取付け位置はある程度任意に選ぶことができるが、観察したい領域が電子線経路がメッシュ77の隙になりTEM観察できなくなる危険性が非常に高かつた。

20

[0032]

ホルダカセット7(保持手段)7は試料ホルダ6を支える治具であり、試料ステージ5に搭載する。試料ステージ5は、ウエハも載置できる汎用の大型ステージや、デバイスチップが搭載できる程度の小型ステージを指す。1個のホルダカセット7に搭載する試料ホルダ6の数は1個でも複数個でも良い。また、試料ステージ5に設置できるホルダカセット7の数は1個でも複数個でも良い。

30

[0033]

光学顕微鏡9には従来の光学式顕微鏡より高分解能が期待できるレーザ走査顕微鏡を用いた。レーザ走査顕微鏡は発振器28を出たレーザ光を対物レンズによって集束して試料に照射して、微小レーザスポットで励起された焦点からの蛍光は、ダイクロイックミラーを通して、試料の焦点と共焦点の位置に設置したアパチャを通ってCCD29に届いて試料の焦点からの蛍光のみによって像が形成される。視野を一機に励起する方法に比較して蛍光は極めて少なく、焦点以外のからの蛍光が板に発生しても、上記アパチャに妨げられてCCD29には到達せずクリヤな像が得られる。試料基板12とダイクロイックミラーの間に2枚のミラーを設置して、X、Y方向に走査することで、試料表面像を得ることができ表示手段13に表示する。この光学顕微鏡9は、試料基板12に予め設置していたマーク(図示せず)座標と、検査部101で得られた座標情報と、関係からなお、集束イオンビーム装置にレーザー顕微鏡を備えた装置については、特開平9-134699号公報『集束イオンビーム装置』(公知例3)に示されているが、試料基板12の特定領域部分を描出する移送手段8の存在については一切記載されていない。

40

100341

移送手段8は試料蓋板が大口径のウエハであっても、その任意の箇所から素早くサンプリ

50

(8)

JP 3677968 B2 2005.8.3

ングすることを実現するために、移動速度が早くストロークが大きい粗動部 6 0 と、粗動部の移動分解能と同等のストロークを有して高い移動分解能の微動部 6 1 とで構成し、移送手段全体を試料ステージと独立して設置して、サンプリング位置の大きな移動は試料ステージ移動に分担させた。粗動部のXYZ方向の駆動はモータやギヤ、圧電素子などで構成して、数mm程度のストロークで、数ミクロンの移動分解能を有している。微動部はできるだけコンパクトであることや、精密移動することが要求されるためバイモルフ圧電素子を用いてサブミクロンの移動分解能を得ている。図 7 は移送手段 8 の粗動部 6 0 と微動部 6 1 の構成例である。粗動部 6 0 は狭窄部 6 2 を支点として支柱 6 3 が 3 個のエンコーダ 6 4 X、6 4 Z、6 4 Y (図示せず) によって XYZ 軸方向に移動できる。粗動部 6 0 の駆動系は試料室壁 6 6 の横ポートを介して大気側にあり、真空はペローズ 6 5 によって遮断されている。バイモルフ圧電素子 6 7 の先端には直径 50 ミクロン程度の細く先端化したタンクステン製のプローブ 6 8 を連結し、粗動部 6 0 とは延長棒 6 9 によって連結した。バイモルフ圧電素子 6 7 に電圧を与えることで、プローブ 6 8 先端は微動する。このように移送手段 8 には、構成、サイズ、設置位置を充分に考慮しなければ、本発明による試料作製装置ではこれらすべてを解決している。

【0035】

この移送手段 8 に類似した従来技術として特開平 5-52721 号公報『試料の分離方法及びこの分離方法で得た分離試料の分析方法』(公知例 2) がある。この従来技術によれば、分離試料を搬送する搬送手段はバイモルフ圧電素子 9 個を XYZ 軸に対応して構成しているが、その搬送手段の設置位置は不明で、唯一上記公報の図 3 からステージ上に設置されていると読み取れる。このように、搬送手段が試料ステージに設置されると、対象試料が例えば直径 300mm のウエハの中心部にある場合では、搬送手段先端の移動ストロークが、搬送手段位置から試料の所要箇所までの距離に比べて遥かに小さいため、試料ステージに設置された搬送手段では届かないという致命的問題点を有することになる。さらに、この 3 軸がバイモルフ圧電素子の構成では、バイモルフ圧電素子は一端を支点にして他端がたわむ動きをするため、他端は印加電圧に従って円弧を描く。つまり、XY 平面内の移動では 1 個のバイモルフ圧電素子の動作のみでは搬送手段先端のプローブが 1 軸方向に直線的に動作しない。従って、3 個のバイモルフ圧電素子で微動部を構成してプローブ先端を所望の位置に移動させるためには 3 個のバイモルフ圧電素子を非常に複雑に制御しなければならないという特性を有している。

【0036】

<実施形態例 2>

上記実施形態例 1 では、ウエハ検査部 101 と試料作製部 102 を機械的に結合させ、試料基板 102 であるウエハを両装置間で搬走させる例を説明した。本実施形態例 2 は図 8 のようにウエハ検査部 101 と試料作製部 102 が機械的に独立していて、不良箇所の座標情報を両者の計算処理装置 17、17' を往来する例である。試料基板であるウエハ 102 は小型で真空状態にできる搬送用容器 107 に封入して運搬する。ウエハ検査部 101 では計算処理装置 17' から情報伝達手段 110 を通じて試料作製部 102 の計算処理装置 17 に伝達できる。このような構成により、ウエハ検査部 101 で検出したウエハ 102 の不良箇所は試料作製部 102 において、各種解析装置で解析し易い形状に加工作製する。

【0037】

<実施形態例 3>

次に、本発明による試料解析方法の一実施形態を説明する。ここでは、試料の例として TEM 観察すべき試料片の作製方法を取り上げ、ウエハ観察から試料片加工、TEM 観察までの試料解析方法の具体的説明を行なう。また、手順を明確にするために以下にいくつかの工程に分割して、図を用いて説明する。

【0038】

(1) 外観検査工程:

まず、検査すべきウエハの全面もしくはその一部について異常の有無を検査する。検査内

10

20

30

40

50

(9)

JP 3677968 B2 2005.8.3

容は、光（レーザ）によるウエハ検査装置や電子ビームによる検査SEMなどの外観検査や、プローブ装置による電気回路検査などである。この検査によって異物や欠陥、記録異常など不良箇所の位置を知ることができる。この時、ウエハに予め設置した目印（ウエハマーク）を基準にして上記不良箇所の該当デバイス座標と、その該当デバイスに予め設置したマークを基準にした座標情報をとして計算処理装置に記憶する。

【0039】

(2) 試料作製工程

(a) マーキング工程：

上記ウエハを試料作製部に導入して、まず、先の該当デバイスの目印（デバイスマーク）を探し出す。ここで、デバイスマークは試料作製部に設置したレーザ顕微鏡で探す。さらに詳しい探索によって上記不良箇所を探し出しが、このとき、FIB照射による二次電子像によって探索すると、試料表面はFIBによってスペッタされるため表面損傷を受け、最悪の場合、所望の解析すべき不良物が無くなってしまうことが生じる。従って、ウエハ検査時のウエハマークとデバイスマークと不良箇所の座標および、試料作製部内でのウエハマークとデバイスマークの座標をもとに、試料作製装置内での不良箇所の座標を計算により算出した後、不良箇所が確認できるように複数カ所にFIBによってマークをつける。

10

【0040】

本例では図9aのように、規範領域を挟んで10ミクロン間隔でナマーク80を2個施した。上記2個のマークを結ぶ直線は試料ステージの傾斜軸と平行になるように事前に、試料ステージを回転調整しておく。

20

【0041】

(b) 大矩形穴加工工程：

上記2個のマーク80を結ぶ直線上で、2個のマークの両側にFIB81によって2個の矩形穴82を設けた。開口寸法は例えば 10×7 ミクロン、深さ15ミクロン程度で、両矩形穴の間隔を30ミクロンとした。いずれも、短時間に完了させるために直径0.15ミクロン程度で電流約10nAの大電流FIBで加工した。加工時間はおよそ5分であった。

【0042】

(c) 垂直溝加工工程：

次に、図9bのように上記マーク80を結ぶ直線より約2ミクロン離れて、かつ、一方の矩形穴82と交わるように、他方の矩形穴には交わらないように幅約2ミクロン、長さ約30ミクロン、深さ約10ミクロンの細長垂直溝83を形成する。ビームの走査方向は、FIBが試料を照射した時に発生するスペッタ粒子が形成した垂直溝や大矩形穴を埋めることがないようにする。一方の矩形穴82と交わらない小さな領域は、後に摘出すべき試料を支える支持部84になる。

30

【0043】

(d) 傾斜溝加工工程：

上記(b)(c)工程の後、試料面を小さく傾斜（本実施例では 20° ）させる。ここで、上記2個のマーク80を結ぶ直線は試料ステージの傾斜軸に平行に設定している。そこで、図9cのように上記マーク80を結ぶ直線より約2ミクロン離れて、かつ、上記細長垂直溝83とは反対側に、上記両矩形穴82を結ぶように、幅約2ミクロン、長さ約32ミクロン、深さ約15ミクロンの溝を形成する。FIB照射によるスペッタ粒子が形成した矩形溝が試料を照射した時に発生するスペッタ粒子が形成した垂直溝や大矩形穴を埋めることのないようとする。試料基板面に対して斜めから入射したFIB81にて、細長傾斜溝85が形成され、先に形成した細長垂直溝83と交わる。(b)から(d)の工程によって、支持部84を残してマーク80を含み、頂角が 70° の直角三角形断面のクサビ型摘出試料が片持ち梁の状態で保持されている状態になる。

40

【0044】

(e) プローブ固定用デボ工程：

次に、図9dのように試料ステージを水平に戻し、摘出すべき試料86の支持部84とは反対の端部に移送手段先端のプローブ87を接触させる。接触は試料とプローブとの導通や两者間の容量変化によって感知することができる。また、不注意なプローブ87の押し

50

(10)

JP 3677968 B2 2005. 8. 3

付けによって、摘出すべき試料 8 6 やプローブ 8 7 の破損を避けるために、プローブが試料に接触した時点で+Z方向運動を停止させる機能を有している。次に、摘出すべき試料 8 6 にプローブ 8 8 を固定するために、プローブ先端を含む約2ミクロン平方の領域に、デボジション用ガスを流出させつつFIBを走査させる。このようにしてFIB照射領域にデボ膜 8 8 が形成され、プローブ 8 7 と摘出すべき試料 8 6 とは接続される。

【0045】

(f) 摘出試料摘出工程：

摘出試料を試料基板から摘出するために、支持部 8 4 にFIB照射してスパッタ加工することで、支持状態から開放される。支持部 8 4 は試料面上から見て2ミクロン平方、深さ約10ミクロンであるため2~3分のFIB走査で除去できる。(図 9 e, f)

10

(g) 摘出試料搬送(試料ステージ移動)工程：

プローブ 8 7 の先端に接続されて摘出した摘出試料 8 9 は試料ホルダに移動させるが、実際に試料ステージを移動させ、FIB走査領域内に試料ホルダ 9 0 を移動させる。このとき、不意の事故を避けるために、プローブを+Z方向に退避させておくとよい。ここで、試料ホルダ 9 0 の設置状態は後述するように種々の形態があるが、本例では、サイドエントリ型のTEMステージ上に設置していることを想定している。(図 9 g)

(h) 摘出試料固定工程：

FIB走査領域内に試料ホルダ 9 0 が入ってくると試料ステージ移動を停止し、プローブを-Z方向に移動させ、試料ホルダ 9 0 に接近させる。摘出試料 8 9 が試料ホルダ 9 0 に接触した時、デボガスを導入しつつ摘出試料 8 9 と試料ホルダ 9 0 と接続部にFIBを照射する。この操作によって摘出試料は試料ホルダに接続できる。本実施例では摘出試料 8 9 の長手方向の端面にデボ膜 9 2 を形成した。FIB照射領域は8ミクロン平方程度で、デボ膜 9 2 の一部は試料ホルダ 9 0 に、一部は摘出試料側面に付着し、両者が接続される。(図 9 h)

20

(i) プローブ切断工程：

次に、デボ用のガスを導入を停止した後、プローブ 8 7 と摘出試料 8 9 を接続しているデボ膜にFIB 8 1 を照射してスパッタ除去することで、プローブ 8 7 を摘出試料 8 9 から分離でき、摘出試料 8 9 は試料ホルダ 9 0 に自立する。(図 9 i)

(j) 試料片加工工程(ウォール加工)：

最後に、FIB照射して、最終的に観察領域を厚さが100nm以下程度のウォール 9 3 になるよう薄く仕上げ加工を施してTEM試料とする。このとき、摘出試料の長手方向の側面の一方が垂直面であるため、ウォール加工のためにFIB照射領域を決定する際、この垂直面を基準にすることで試料基板 8 9 表面にはほぼ垂直なウォール 9 3 を形成することができる。また、FIB照射に先立ち、ウォール面をより平面的に加工するために、ウォール形成領域を含む上面にFIBデボ膜を形成しておくとよい。この方法は既によく知られている。上述の加工の結果、横幅約1.5ミクロン、深さ約1.0ミクロンのウォールが形成でき、TEM観察領域ができる。以上、マーキングからウォール加工完成まで、約1時間30分で、従来のTEM試料作製方法に比べて数分の1に時間短縮できた。(図 j)

30

(k) 解析工程(TEM観察)：

ウォール加工後、サイドエントリ型TEMステージを引き抜き、TEMの試料室に導入する。このとき、電子線経路と、ウォール面が垂直に交わるようにTEMステージを回転させて挿入する。その後のTEM観察技術についてはよく知られているので、ここでは省略する。

40

【0046】

なお、上記試料解析方法のうち試料作製工程に類似した従来技術として公知例2がある。本試料作製工程が従来方法と全く異なることを示すために従来方法を図10で説明する。まず、試料 5 0 の表面に対しFIB 2 4 が直角に照射するように試料 5 0 の姿勢を保ち、試料上でFIB 2 4 を矩形に走査させ、試料表面に所要の深さの角穴 5 1 を形成する(図 10 (a))。次に、試料表面に対するFIBのThetaが約70°傾斜するように試料を傾斜させ、底穴 5 2 を形成する。試料の傾斜角の変更は、試料ステージ(図示せず)によって行われる(図 2 を参照)。試料の姿勢を変更し、試料の表面がFIBに対して再び垂直になるように試料を

50

(11)

JP 3677968 B2 2005. 8. 3

設置し、切り欠き溝 5 3 を形成する（図 10 (c)）。マニピュレータ（図示せず）を駆動し、マニピュレータ先端のプローブ 5 4 の先端を、試料 5 0 を分離する部分に接触させる（図 10 (d)）。ガスノズル 5 5 から堆積性ガス 5 6 を供給し、FIBをプローブの先端部を含む領域に局所的に照射し、イオンビームアシストデポジション膜（以下、デボ膜 5 7 と略す）を形成する。接触状態にある試料の分離部分とプローブ 4 4 の先端はデボ膜 4 6 と接続される（図 10 (e)）。FIB 2 4 で残りの部分を切り欠き加工し（図 10 (f)）、試料 5 0 から分離試料 5 8 を切り出す。切り出された分離試料 5 8 は、接続されたプローブ 5 4 で支持された状態になる（図 10 (g)）。この分離試料 5 8 を、上記第 2 の従来手法と同様にFIBで加工し、観察しようとする領域をウォール加工するとTEM試料（図示せず）となる。

10

【0047】

試料基板から微小試料を摘出するためには、微小試料を基板から分離することが必須で、摘出試料の底面となる面と基板との分離工程（以下、底液いと呼ぶ）が伴う。公知例 2 に示されたFIBによる底液い法では、基板表面に対し斜方向からFIBを入射させて加工するため、摘出した試料片の底面には、底液い時のイオンビーム入射角と加工アスペクト比からなる傾斜が付く。また、図 10 b に示した斜めからのFIB照射を実現するための角穴 5 1 が非常に大さくなければならない。これは角穴 5 1 の形成時に多大の時間を要することを示している。また、この公知例では斜めFIB照射するために試料を約 70° も大きく傾斜させている。FIBの集束性から要求される対物レンズと試料との間隔を考慮すると、このような大傾斜はFIB性能を悪化させてしまい、満足な加工が出来ないと予想される。通常用いられているFIB装置性能を維持するには 60° 程度が限度である。また、直徑 800mm など大口径ウエハ用試料ステージを 70° も大きく傾斜させることは、機械的に非常に困難である。たとえ 70° の大傾斜が可能としても摘出試料の底面は 70° の傾斜を持ち、水平面の試料ホルダに設置すると、本来の試料表面は試料ホルダ面に対して 20° も傾斜しており、表面に対してほぼ垂直な断面やウォールを形成することが困難となる。試料基板の表面に対しほぼ垂直な断面やウォールを形成するためには、底面の傾斜を小さくして底面を表面に平行に近くすることが必須で、そのためには試料傾斜をさらに大きくしなければならず、これは上述の装置上の制約からさらに困難になる。従って、本発明が目指すような摘出した試料を別の部材（試料ホルダ）に設置して、他の観察装置や分析装置に導入するためには、垂直断面が形成できる別の底液い方法を検討しなければならない。（但し、公知例 2 では分離した試料は試料ホルダの類に設置することなく、搬送手段のプローブに付けたまま観察する方法であるため、底面の形状は影響しない。）

20

このように、本発明による試料作製工程と公知例 2 による試料分離方法と大きく異なる点は、(1)試料の摘出（分離）に際してのビーム照射方法が全く異なり、摘出試料をなるべく薄くするためと、底面の分離を簡便に、また、試料ステージの傾斜をなるべく小さくするため長手方向（TEM観察面に平行方向）の側面を傾斜加工したこと、(2)摘出した試料は移送手段とは別の部材である試料ホルダに固定することにあり、ウエハからも試料片が摘出できる試料作製装置と試料作製方法を提供している。

【0048】

40

<実施形態例 4>

上記実施形態例の試料解析工程はTEM解析に限らず、他の観察手法、分析手法や観察手法に用いることも可能である。

【0049】

50

例えば、解析装置がインレンズ型の高分解能SEMである場合にも適用できる。インレンズ型SEMは観察試料を対物レンズ内に入れる方式で、分解能がアウトレンズに比べて非常に良いため表面観察の強力なツールであるが、試料をレンズ内に入れる都合上、数ミリ程度に小さくしなければならない。従って、ウエハ検査装置などで不良箇所を発見し、その部分をさらに詳しく観察しようとしてもウエハのままではインレンズ型の走査電子顕微鏡内に導入することはできず、ウエハを分断して細分化せざるを得なかつた。本発明による試料解析方法によると、ウエハから所望の領域の試料片を摘出することができるため、イン

(12)

JP 3677968 B2 2005.8.3

レンズ型SEMで高分解能観察をすることができる。観察領域はウエハ表面ばかりでなく、摘出する際に形成できる断面も観察できるため、試料片摘出時のFIB照射方向を適切に行なえば、不良箇所の断面も観察することができる。このような方法によって、座標の問題、試料作製の問題、ウエハ分割の問題を解決して試料解析を行なうことができる。また、その他、オージェ電子分光分析や二次イオン質量分析など元素分析を行なう試料解析についても同様に行なえる。

付記：

1. 目的とする試料片を観察、分析、計測のうちの少なくともいずれかによって調べる試料解析方法であって、試料基板を検査手段によって検出した異物や欠陥など所望箇所の座標情報を記憶する工程と、上記所望箇所の座標情報を基にして上記試料基板から上記所望箇所を含む試料片を集束イオンビームによる加工を利用して摘出して、上記摘出した上記試料片を分析装置または観察装置または計測装置のうちの少なくともいずれかに対応する試料ホルダに固定し、上記試料ホルダに固定した上記試料片を分析または観察または計測のうちの少なくともいずれかに適する形状に加工する工程と、上記試料片を固定した上記試料ホルダを分析装置または観察装置または計測装置のうちの少なくともいずれかに導入して上記所望箇所の解析を行なう工程とからなることを特徴とする試料解析方法。
10
2. 上記1記載の試料解析方法において、特に、上記検査手段が光学式ウエハ検査装置、ウエハ検査用走査電子顕微鏡、レーザ走査顕微鏡、光学式顕微鏡のうちの少なくともいずれかを用いることを特徴とする試料解析方法。
3. 上記1または2記載の試料解析方法において、特に、上記試料片を集束イオンビームによる加工を利用して摘出する工程の前に、光学顕微鏡による位置合わせ工程をともなうことを特徴とする試料解析方法。
20
4. 上記1から3のいずれかに記載の試料解析方法において、特に、上記試料片を集束イオンビームによる加工を利用して摘出する工程の前に、上記集束イオンビームによって上記所望箇所近傍に上記所望箇所が確認できる目印を付す工程をともなうことを特徴とする試料解析方法。
5. 上記1から4のいずれかに記載の試料解析方法において、さらに、上記試料ホルダに固定した上記試料片に対してさらに集束イオンビーム照射による薄壁加工を施して透過型電子顕微鏡観察用の試料に仕上げる工程を含むことを特徴とする試料解析方法。
6. ウエハを検査して異物や欠陥など所望箇所の座標情報を記憶するウエハ検査部と、上記所望箇所の座標情報を基にして上記試料基板に対して集束イオンビームを利用して上記所望箇所を含む試料片を摘出して分析または観察または計測のうちの少なくともいずれかに適する試料ホルダに固定して加工する試料作製部とから構成して、上記ウエハ検査部と試料作製部とは上記ウエハを移動するための真空搬送路によって連結した構造であることを特徴とする試料解析装置。
30
7. ウエハを検査して異物や欠陥など所望箇所の座標情報を記憶するウエハ検査部と、上記所望箇所の座標情報を基にして上記試料基板に対して集束イオンビームを利用して上記所望箇所を含む試料片を摘出して分析装置または観察装置または計測装置のうちの少なくともいずれかに適する試料ホルダに固定して、分析装置または観察装置または計測装置のうちの少なくともいずれかに適する形状の試料片に加工する試料作製部と、上記試料片の解析を行なう分析装置または観察装置または計測装置のうちの少なくともいずれかの解析部とを少なくとも有して、上記ウエハ検査部と試料作製部、解析部とは上記ウエハを移動するための真空搬送路によって連結した構造であることを特徴とする試料解析装置。
40
8. ウエハを検査して異物や欠陥など所望箇所の座標情報を記憶するウエハ検査部と、上記所望箇所の座標情報を基にして上記試料基板に対して集束イオンビームを利用して上記所望箇所を含む試料片を摘出して分析装置または観察装置または計測装置のうちの少なくともいずれかに適する試料ホルダに固定して、分析装置または観察装置または計測装置のうちの少なくともいずれかに適する形状の試料片に加工する試料作製部と、上記試料片の解析を行なう分析装置または観察装置または計測装置のうちの少なくともい
50

(13)

JP 3677968 B2 2005.8.3

それかの解析部とが機械的に独立して構成され、少なくとも上記ウエハ検査部での上記所望箇所の座標情報を上記試料作製部と上記解析部に伝達する情報伝達手段によって連結した構造であることを特徴とする試料解析装置。

9. 上記 8 記載の試料解析装置において、さらに、

上記ウエハ検査部と上記試料作製部と上記解析部の間は、上記ウエハおよび上記試料ホルダもしくは上記試料ホルダを搭載した治具を真空容器によって搬送する構造であることを特徴とする試料解析装置。

10. 上記 6 から 9 のいずれかに記載の試料解析装置において、特に、上記検査装置が光学式ウエハ検査装置、ウエハ検査用走査電子顕微鏡、レーザ走査顕微鏡、光学式顕微鏡のうちのいずれかであることを特徴とする試料解析装置。

11. 上記 5 から 9 のいずれかに記載の試料解析装置において、上記解析部における観察装置が、特に、インレンズ型走査型電子顕微鏡、透過型電子顕微鏡のうちのいずれかであることを特徴とする試料解析装置。

[0050]

【発明の効果】

本発明による試料解析方法および装置を用いることで、所望の箇所をマークしたその場で、ウエハを細分化することなく、また、ウエハから人の手作業を介することなくTEM観察の始めその他の分析、計測、観察のための試料を作製でき、解析結果を得るまでの時間を短縮させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明による試料解析装置の一実施形態を示す構成ブロック図。

【図 2】従来のTEM試料の作製手順を説明するための図。

【図 3】従来のTEM試料の別の作製手順を説明するための図。

【図 4】本発明による試料解析装置のうち試料作製部の一実施形態を説明するための構成ブロック図。

【図 5】本発明による試料解析装置の実施形態で特に試料ホルダを説明するための図。

【図 6】従来のTEMホルダを説明するための図。

【図 7】本発明による試料解析装置の実施形態における試料作製部のうち、特に移送手段の一実施形態を説明するための図。

【図 8】本発明による試料解析装置の別の実施形態を示す構成ブロック図。

【図 9】本発明による試料解析方法における試料作製工程について説明するための図。

【図 10】従来のTEM用試料ホルダーについて説明するための図である。

【符号の説明】

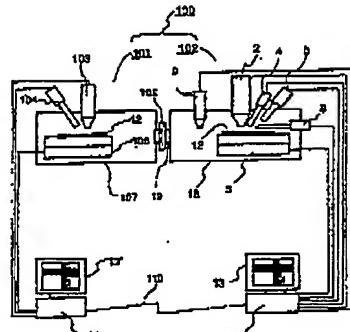
2 … FIB照射光学系、3 … 二次粒子検出器、4 … デボガス源、5 … 試料ステージ、6 … 試料ホルダ、7 … 保持手段（ホルダカセット）、8 … 移送手段、9 … 光学顕微鏡、100 … 試料解析装置、101 … ウエハ検査部、102 … 試料作製部、103 … 電子ビーム照射系、104 … 二次電子検出器、105 … 試料ステージ、107 … 搬送用容器、110 … 情報伝達手段。

(14)

JP 3677968 B2 2005.8.3

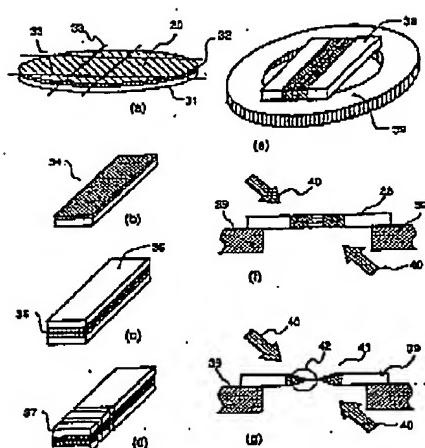
[圖 1]

1



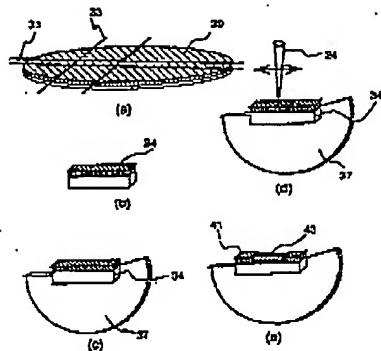
[図2]

四 2



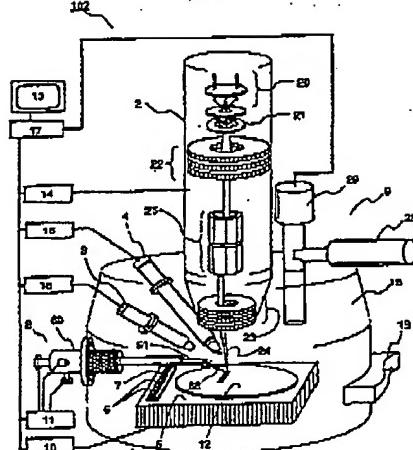
[図3]

3



〔図4〕

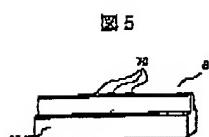
四



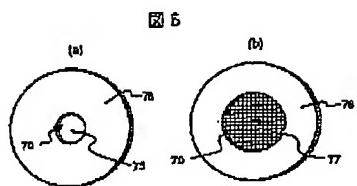
(15)

JP 3677968 B2 2005.8.3

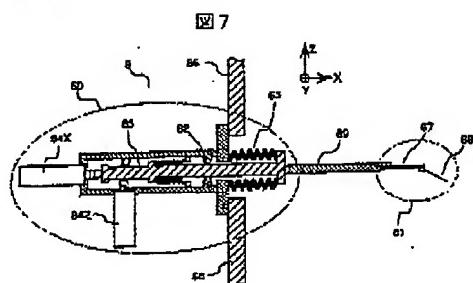
【図 5】



【図 6】



【図 7】



【図 8】

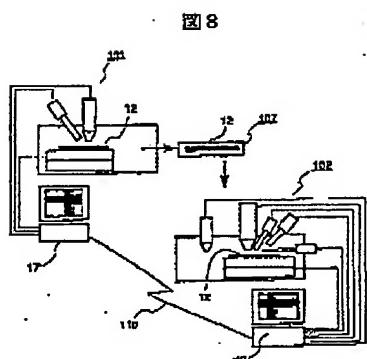
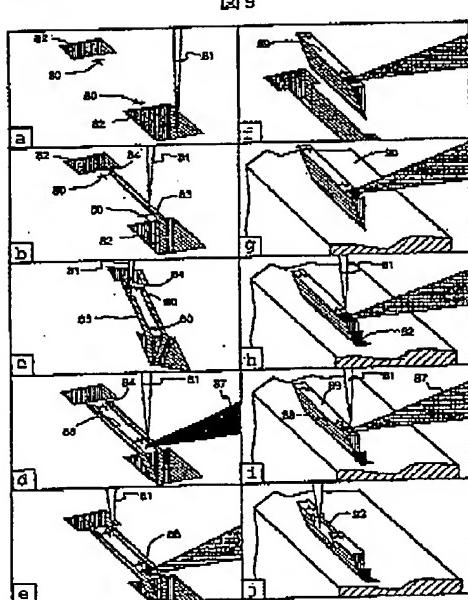


図 8

【図 9】

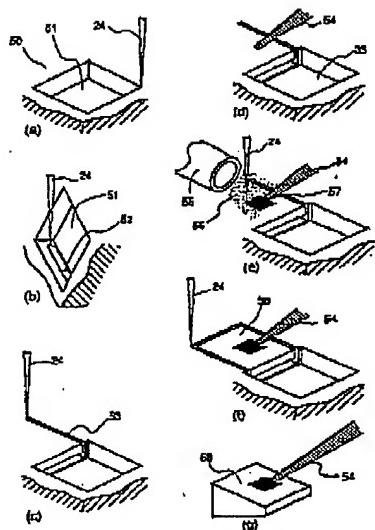


(16)

JP 3677968 B2 2005. 8. 3

【図 10】

図 10



2005/NOV/10/THU 05:14 PM MICHAEL O SCHEINBERG

FAX No. 512 306 1963

P. 039

(17)

JP 3677868 B2 2005.8.3

フロントページの続き

- (56)参考文献 特開平05-052721 (JP, A)
特開平07-333120 (JP, A)
特開平09-189649 (JP, A)
特開平02-294644 (JP, A)
特開平03-076122 (JP, A)

(58)調査した分野(Int. Cl.?, DB名)

G01N 1/28

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.